

談話室

第 15 回表面科学基礎講座 —表面・界面分析の基礎と応用—

太田 英二

慶應義塾大学理工学部
〒223 横浜市港北区日吉 3-14-1

(1993 年 8 月 2 日 受理)

The 15th Surface Science Lecture Course

Eiji OHTA

Keio University
3-14-1 Hiyoshi Kohoku-ku Yokohama 223

(Received August 2, 1993)

平成 5 年度春季の表面科学基礎講座は昨年同様「表面界面分析の基礎と応用」と題して 6 月 2 日(水)から 4 日(金)までの 3 日間、東京御茶ノ水の総評会館で開催された。

昨年からの景気後退に伴って、参加者がどの程度になるか当初心配されたが、各方面のご協力もあって 92 名の受講者があり、また討論も活発で盛会であった。

準備段階ではこれまでの内容を再検討すべきかどうか討論されたが、表面科学会の定番としてこれまでの内容を踏襲することになった。基礎講座におけるアンケートで見る限り研修を目的とした受講者、基礎を勉強しなおしたい受講者が多く、表面・界面分析の基礎的技術解説

を重視することによってそのニーズに答えられたと思われる。景気の後退にもかかわらず多数の参加者があったことは、分析技術の進歩にもかかわらず本講座の考え方がいつの時代にも通用するものであることを示している。

今回お願いした講師は、常連の方が多く本講座の趣旨をよく理解していただいていたため適切な講義が多かった。ただし受講者がとりあげたすべての分析技術に通じているわけではないため、一部の講義については基礎的な事柄についても説明して欲しいとの要望、もっと時間をかけての説明が欲しいとの要望が寄せられていた。

最終日には総合討論が行われ、今回初めての試みとして、あらかじめ質問票を配布した。これにより質問に対して的確な回答を用意する余裕ができた点は適切であった。質問の内容は講義に関連したことから分析の際に実際に直面していることなど多岐にわたっていたが、その場に出席されていた講師の方々の手に余る質問は実行委員を通じて適切な講師に照会して回答していただいた。講師の先生方にはテキストの作成から講義、討論、そして事後の質問への回答など熱心にご協力をいただいた。改めて感謝の意を表したい。

また、本講座の企画運営にご協力いただいた企画委員会、事務局および関係者の方々にこの場を借りて御礼を申し上げたい。

なお 11 月 18 日(木)、19 日(金)両日には、大阪三田出版会において秋季基礎講座(第 16 回)が開催されることになっている。多数の方のご参加をお願いしたい。

第 15 回表面科学基礎講座プログラム (1993 年 6 月 2 日～4 日、於総評会館)

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. 表面・界面分析概論 | 福田 安生 (静大電子研) |
| 2. 電子線回折 (LEED, RHEED) | 一宮 彪彦 (名大工) |
| 3. 電子顕微鏡 (TEM, SEM) | 板東 義雄 (無機材研) |
| 4. 走査プローブ顕微鏡 (STM/AFM) | 野副 尚一 (物質研) |
| 5. 電子線マイクロアナライザ (EPMA) | 奥村 豊彦 (日本電子) |
| 6. ラザフォード後方散乱 (RBS) | 草尾 健司 (松下テクノリサーチ) |
| 7. 赤外分光 (FT-IR), ラマン分光 | 石田 英之 (東レリサーチセンタ) |
| 8. 電子分光装置の基礎 | 大岩 烈 (アルバック・ファイ) |
| 9. オージェ電子分光法 (AES) | 吉原 一紘 (金材技研) |
| 10. X線光電子分光法 (XPS) | 広川吉之助 (東北大金研) |
| 11. 二次イオン質量分析法 (SIMS) | 工藤 正博 (成蹊大) |
| 12. 質疑応答, 総合討論 | |